

ЭФФЕКТ ХОЛЛА ПРИ ПАЙЕРЛСОВСКОМ ПЕРЕХОДЕ В TaS_3

Ю.И.Латышев, Я.С.Савицкая, В.В.Фролов

Установлен положительный знак и активационный характер температурной зависимости константы Холла в TaS_3 ниже температуры пайерловского перехода T_p . Обнаружено аномальное уменьшение холловской подвижности носителей в области $T \geq T_p$.

Первые исследования эффекта Холла в $NbSe_3$ ^{1,2} показали плодотворность этой методики для изучения пайерловского состояния в квазидиодномерных проводниках. Так, например, в³, основываясь на холловских измерениях было доказано существование электронно-дырочных карманов в $NbSe_3$ в области температур ниже второго пайерловского перехода.

На другом, интенсивно исследуемом квазидиодномерном соединении класса MX_3 , орторомбическом TaS_3 , холловские измерения проводились пока только при комнатной температуре⁴. До последнего времени в TaS_3 не был точно установлен знак носителей, поскольку измерения в⁴ велись на переменном токе, а имеющиеся работы по термоэдс^{5,6} противоречили друг другу. Главное же, с помощью эффекта Холла в TaS_3 еще не изучался пайерловский переход ($T_p = 210$ К) и само пайерловское состояние. Это обстоятельство и определило задачу настоящей работы.

Образцы орторомбического TaS_3 получали кристаллизацией из газовой фазы⁷. Холловская ЭДС измерялась на постоянном токе в направлении кристаллографической оси b , измерительный ток пропускался вдоль образца, в направлении оси c , а поле H было направлено по a . При этом электрическое поле вдоль образца не превышало 0,3 В/см, что соответствовало омическому характеру проводимости. Поперечные контакты изготавливались по методике, подробно описанной в⁷. Температура образца контролировалась калиброванным кремниевым диодом и поддерживалась постоянной с помощью автоматического моста с точностью 40 мК. Холловская ЭДС измерялась фотокомпенсационным нановольтметром Ф-138.

При комнатной температуре было измерено шесть образцов, на всех них константа Холла R_x была положительной. Величина R_x при комнатной температуре составляла в среднем $3,5 \pm 0,7 \cdot 10^{-3}$ см³/Кл, в пять раз больше, чем в работе⁴. Зависимость холловской ЭДС от магнитного поля была линейной при комнатной температуре (рис.1) и сохраняла линейный вид при температурах ниже пайерловского перехода во всем исследованном температурном интервале.

Типичная зависимость R_x от температуры представлена на рис.2. Как видно из этого рисунка, в области 400 – 260 К R_x практически не зависит от температуры, затем в области пайерловского перехода она, оставаясь положительной, резко увеличивается примерно на порядок и, наконец, ниже 160 К выходит на активационную зависимость $R_x \sim \exp \Delta/T$ с энергией активации $\Delta = 1000$ К. Отклонения зависимости $\lg R_x(1/T)$ от этой прямой вплоть до 80 К не наблюдалось. При понижении температуры от 260 до 80 К R_x возрастила, не меняя знака, в $2 \cdot 10^4$ раза.

Полученные результаты (в предположении справедливости зонной модели) указывают на то, что в исследованной температурной области проявляется вклад носителей одного типа, дырочного (см. также⁶). В этом случае должно быть равно нулю поперечное магнетосопротивление³. Проведенные измерения показали, что $\frac{\rho_{||}(H) - \rho_{||}(0)}{\rho_{||}(0)}$ действительно рав-

но нулю с экспериментальной точностью (10^{-3}) во всей области $400 \text{ K} > T > 80 \text{ K}$ и в полях до 8 кЭ. В этом случае R_x выражается только через концентрацию носителей p : $R_x =$

$= (pec)^{-1}$ (1), а анизотропия проводимости определяется анизотропией подвижности: $\mu_{||} = (\rho_{||} pe)^{-1}$ (2), $\mu_{\perp} = (\rho_{\perp} pe)^{-1}$ (3).

Из измерений R_x и $\rho_{||}$, ρ_{\perp} при комнатной температуре получаем $p_{300} = 1,8 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$, $\mu_{||300} = 10 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, $\mu_{\perp300} = 0,06 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. С понижением температуры концентрация носителей падает $p_{80} = 1,1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, а их подвижность растет $\mu_{||80} = 250 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, $\mu_{\perp80} = 0,38 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. Уменьшение концентрации дырок свидетельствует о том, что энергетическая щель открывается в TaS_3 , как и в случае NbSe_3 ³, на дырочной стороне поверхности Ферми, но в отличии от NbSe_3 в TaS_3 , по-видимому, не остается карманов свободных носителей на поверхности Ферми ниже температуры пайерлсовского перехода. На это указывает тот факт, что рост R_x до 80 К идет по активационному закону без каких-либо следов насыщения (рис.2) и тот известный факт, что $\rho(T)$ в TaS_3 продолжает расти вплоть до гелиевых температур⁸. Во всяком случае, при 80 К концентрация носителей в TaS_3 уже на порядок меньше, чем соответствующая концентрация носителей в „карманах“ в NbSe_3 при 2 К.

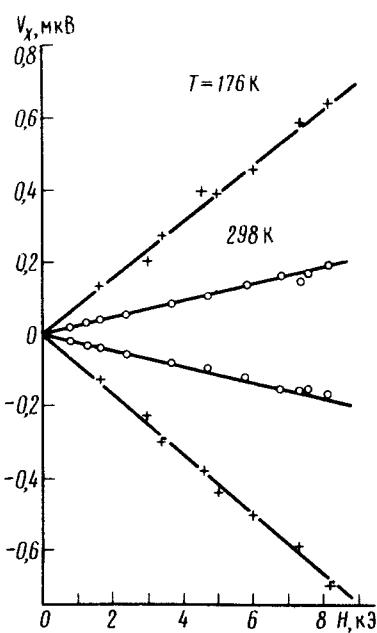


Рис.1

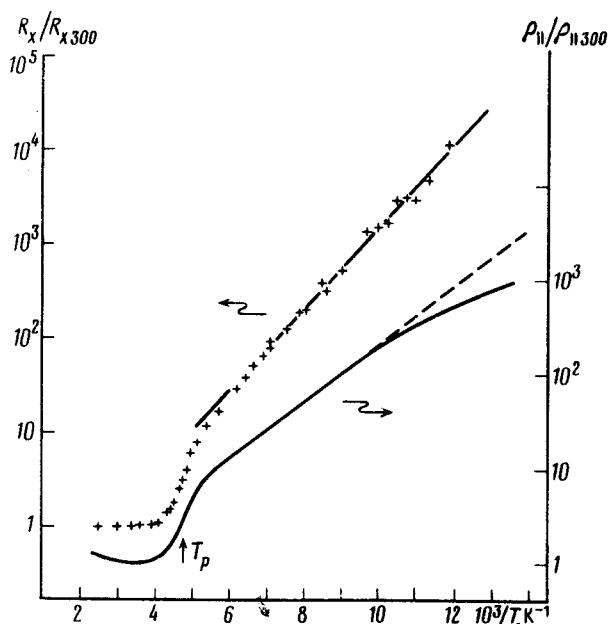


Рис.2

Рис.1. Зависимость холловской ЭДС V_x от величины H (образец № 3). Две ветви соответствуют противоположным направлениям магнитного поля. При $T = 176 \text{ K}$ ток через образец составлял 0,36 мА, при $298 \text{ K} - 2,07 \text{ мА}$. Размеры образца $4,6 \times 0,06 \times 0,033 \text{ мм}^3$

Рис.2. Температурные зависимости константы Холла и удельного сопротивления (в продольном направлении) образца № 3, нормированные на собственные значения при 300 К. $R_{x300} = 4,4 \cdot 10^{-3} \text{ см}^3/\text{Кл}$, $\rho_{||300} = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}$

Сравнение температурных зависимостей $R_x(T)$ и $\rho(T)$, представленных на рис.2, показывает, что увеличение R_x с понижением температуры при $T < 160 \text{ K}$ происходит с большей энергией активации, чем рост ρ . Это, очевидно, связано с тем, что рост R_x определяется только вымораживанием носителей, тогда как рост ρ частично компенсируется увеличением их подвижности при понижении температуры.

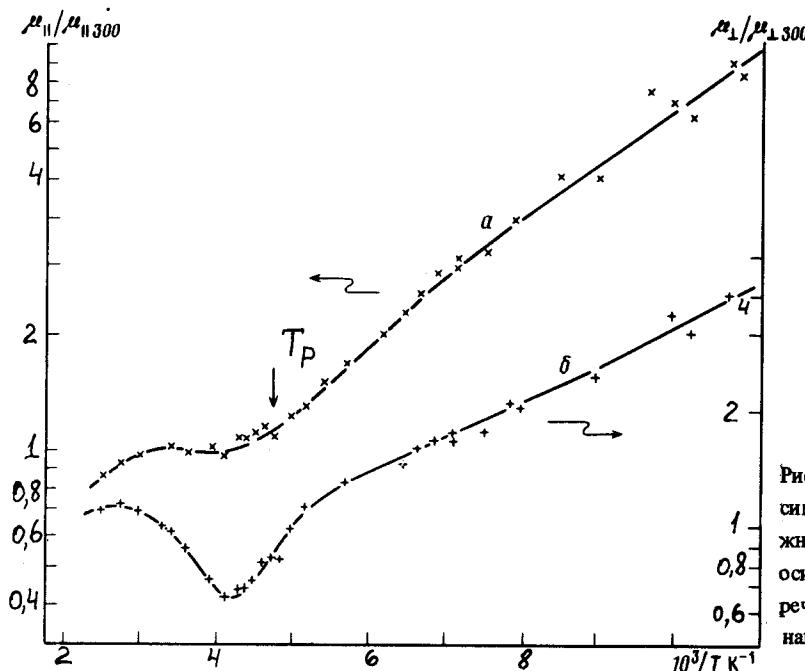


Рис.3. Температурные зависимости холловской подвижности в продольном, вдоль оси c (кривая a) и в поперечном, по оси b , (кривая b) направлениях. Образец № 3

Из сравнения $R_x(T)$ и $\rho(T)$ в области температур ниже 110 К следует, что отклонение $\rho(T)$ от активационной зависимости в этой области^{8,9} не связано с изменением величины пайерлсовской щели, поскольку зависимость $R_x(T)$ в этой области идет с постоянной энергией активации. Мы не наблюдали также никаких особенностей в зависимости $R_x(T)$ в области 140 – 160 К, соответствующей переходу несоизмеримость – соизмеримость в орторомбическом TaS_3 ¹⁰.

В области 400 – 260 К концентрация носителей постоянна и не зависит от температуры. Уменьшение ρ начинает происходить с температурой, на 50 К превышающих температуру пайерлсовского перехода и при $T = T_p$ (T_p определялась по положению резкого максимума $d \lg \rho / d(1/T)$) уменьшается уже в три раза, что указывает на наличие щели в области $T > T_p$.

В этой температурной области нами было обнаружено аномальное уменьшение холловской подвижности носителей (рис.3). Значения подвижности при разных температурах определялись из одновременных измерений $R_x(T)$ и $\rho(T)$ в соответствии с (2). Как видно из рис.3 (кривая a), на фоне общего роста $\mu(T)$ с понижением температуры в области, непосредственно предшествующей T_p , наблюдается уменьшение подвижности. Максимальный „провал“ в $\mu(T)$ достигается при 220 – 210 К.

Мы предположили, что аномалия температурной зависимости подвижности носителей связана со смягчением фононного спектра в области, предшествующей пайерлсовскому переходу, поскольку смягчение фононной частоты (см., например,¹¹) увеличивает амплитуду рассеяния на мягком фононе с понижением температуры $T \rightarrow T_p$. Это дополнительное рассеяние и проявляется в уменьшении подвижности носителей.

В силу 3-мерности фононного спектра подобное уменьшение подвижности ожидалось увидеть и в поперечном направлении. Специально проведенные измерения $\rho_{\perp}(T)$ вместе с $R_x(T)$ показали, что это, действительно, наблюдается на эксперименте (рис.3, кривая b). При этом относительные уменьшения подвижностей в продольном и поперечном направлениях оказываются одного порядка $\delta \mu_{\parallel} / \mu_{\parallel} \approx \delta \mu_{\perp} / \mu_{\perp}$.

Аналогичные аномалии подвижности, по всей видимости, должны наблюдаться и на других квазиодномерных соединениях при $T \rightarrow T_p$.

Авторы выражают благодарность А.Ф.Волкову, С.Н.Артеменко и Е.Н.Долгову за ценные замечания при обсуждении результатов работы.

Литература

1. Fleming R.M., Polo J.A., Coleman R. V. Phys. Rev., 1978, **B17**, 1634.
2. Ong N.P., Monceau P. Solid State Comm., 1978, **26**, 487.
3. Ong N.P. Phys. Rev., 1978, **B18**, 5272.
4. Ong N.P., Tessema G.X., Verma G., Eckert J.C., Savage J., Khanna S.K. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 1982, **81**, 41.
5. Allgeyer R., Suits B.H., Brown F.C. Solid State Comm., 1982, **43**, 207.
6. Fisher B. Solid State Comm., 1983, **46**, 227.
7. Зыбцев С.Г., Латышев Ю.И., Савицкая Я.С., Фролов В.В. Препринт ИРЭ АН СССР, № 11, 1983.
8. Жилинский С.К., Иткис М.Е., Кальнова И.Ю., Надь Ф.Я., Преображенский В.Б. ЖЭТФ, 1983, **85**, 362.
9. Zettl A., Grüner G., Thompson A.H. Phys. Rev., 1982, **B26**, 5760.
10. Wang Z.Z., Salva H., Monceau P., Renard M., Roucau C., Ayroles R., Levy F., Guemas L., Meerschaut A. J. Physique Lett., 1983, **44**, L 311.
11. Горьков Л.П., Долгов Е.Н., Лебедев А.Г. ЖЭТФ, 1982, **82**, 613.

Институт радиотехники
и электроники
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
23 сентября 1983 г.